

– 誘電体円柱試料の複素比誘電率および導体板の表面比導電率を測定するためのソフトウェア

■ 測定範囲&測定精度

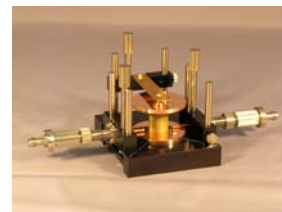
周波数  $f$  : 2~30GHz  
 比誘電率  $\epsilon_r$  : 2~1000,  $\pm(0.2\sim0.5)\%$   
 誘電正接  $\tan\delta$  :  $10^{-3}\sim10^{-7}$ ,  $\pm(5\sim20)\%$   
 表面比導電率  $\sigma_f$  : 10~100%,  $\pm(2\sim10)\%$

■ 測定に使用する導体板の必要寸法

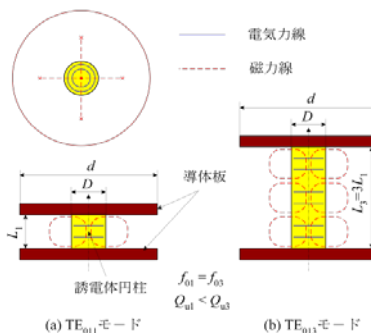
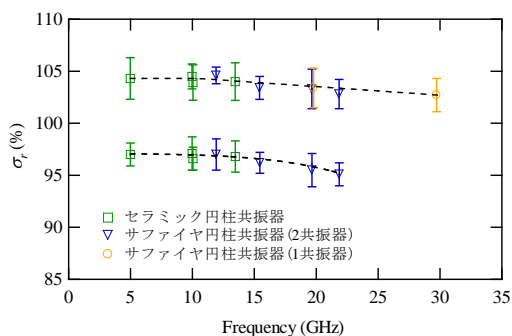
測定周波数	円板直径
5~30GHz	40mmφ
2~15GHz	70mmφ

\* $\epsilon_r=38$  の時の例となります

■ 測定に用いる誘電体円柱共振器と測定治具の外観



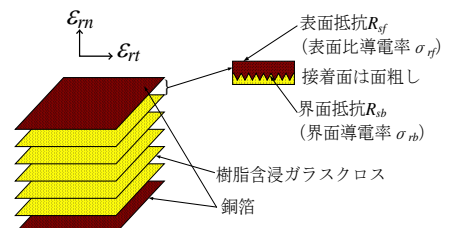
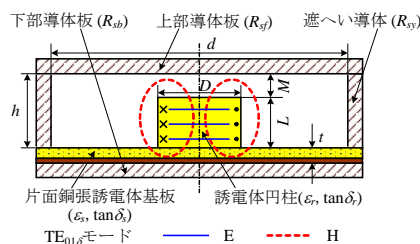
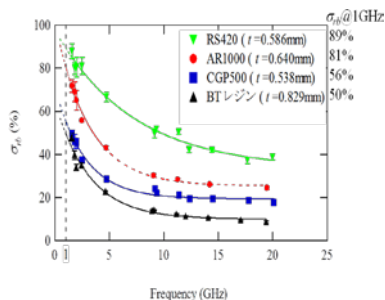
■ 表面比導電率の測定結果例と誘電体円柱共振器の構成図



2種類の銅板の表面比導電率の周波数依存性測定結果

SUM-MIC – 銅張誘電体基板の界面比導電率を測定するためのソフトウェア [測定治具を商品開発中]

■ 周波数依存性の測定結果例と測定治具および銅張誘電体積層基板の構造



4種の片面銅張誘電体基板のsigma\_fbの測定結果

サムテック株式会社

〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保 255 埼玉大学 地域オープンイノベーションセンター内

E-Mail : info@sumtec.biz ホームページ : http://www.sumtec.biz

材料測定

検索